

HANSER

Einführung in die Mikrosystemtechnik

Jan Mehner, Wolfram Dötsel, Gerald Gerlach

Ein Kursbuch für Studierende

ISBN 3-446-22558-7

Inhaltsverzeichnis

Weitere Informationen oder Bestellungen unter
<http://www.hanser.de/3-446-22558-7> sowie im Buchhandel

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Einführung | 13 |
| 1.1 | Was ist ein Mikrosystem?..... | 16 |
| 1.2 | Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik | 20 |
| 1.3 | Anwendungsfelder und Entwicklungstrends..... | 22 |
| 1.4 | Beispiel Drehratensor | 23 |
| 1.4.1 | Aufbau und Funktion | 24 |
| 1.4.2 | Funktionskomponenten und -elemente | 26 |
| 2 | Skalierung und Ähnlichkeit | 31 |
| 2.1 | Skalierung..... | 31 |
| 2.2 | Ähnlichkeit und Kennzahlen | 37 |
| 3 | Werkstoffe..... | 43 |
| 3.1 | Übersicht | 43 |
| 3.2 | Einkristallines Silizium..... | 47 |
| 3.2.1 | Beschreibung der Orientierung von Flächen und Richtungen im Kristall..... | 48 |
| 3.2.2 | Oberflächeneigenschaften bei verschiedener Orientierung..... | 55 |
| 3.2.3 | Anisotrope elastische Eigenschaften | 56 |
| 3.2.4 | Festigkeit | 59 |
| 3.2.5 | Siliziumscheiben | 63 |
| 3.3 | Gläser | 67 |
| 3.3.1 | Allgemeine Eigenschaften von Glas | 68 |
| 3.3.2 | Viskoelastisches Verhalten | 69 |
| 3.3.3 | Gläser in der Mikrosystemtechnik | 71 |
| 3.4 | Polymere | 73 |
| 3.4.1 | Thermoplastische Werkstoffe in der Mikrosystemtechnik..... | 74 |
| 3.4.2 | Fotoresist | 77 |
| 3.5 | Dünnschichten | 79 |
| 3.5.1 | Siliziumoxid, Siliziumnitrid | 82 |
| 3.5.2 | Elektrisch leitende Schichten..... | 84 |
| 3.5.3 | Polysiliziumschichten | 84 |
| 3.6 | Materialeigenschaften im Vergleich | 85 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 4 | Mikrotechnische Fertigungsverfahren..... | 88 |
| 4.1 | Überblick | 88 |
| 4.2 | Reinheit in der Fertigung..... | 94 |
| 4.2.1 | Reinraumtechnik..... | 95 |
| 4.2.2 | Waferreinigung..... | 99 |
| 4.3 | Lithografie | 101 |
| 4.3.1 | Prinzip..... | 101 |
| 4.3.2 | Lithografischer Prozess | 102 |
| 4.3.3 | Minimal strukturierbare Linienbreiten | 105 |
| 4.3.4 | Doppelseitenlithografie | 106 |
| 4.3.5 | Lithografie in stark profilierten Strukturen..... | 106 |
| 4.4 | Schichtherstellung..... | 107 |
| 4.4.1 | Überblick | 107 |
| 4.4.2 | Schichtkonformität..... | 109 |
| 4.4.3 | Thermische Oxidation..... | 109 |
| 4.4.4 | Aufdampfen | 111 |
| 4.4.5 | Sputtern..... | 113 |
| 4.4.6 | Chemische Gasphasenabscheidung..... | 115 |
| 4.4.7 | Vergleich | 117 |
| 4.5 | Schichtstrukturierung..... | 118 |
| 4.5.1 | Grundlagen | 118 |
| 4.5.2 | Nassätzen | 120 |
| 4.5.3 | Trockenätzen | 120 |
| 4.5.4 | Lift-off-Prozess | 123 |
| 4.6 | Anisotropes nasschemisches Tiefenätzen..... | 123 |
| 4.6.1 | Prinzip | 124 |
| 4.6.2 | Anisotrope Ätzlösungen..... | 125 |
| 4.6.3 | Ätzraten..... | 126 |
| 4.6.4 | Ätzstoppverfahren | 129 |
| 4.6.5 | Ätzfiguren | 131 |
| 4.6.6 | Entwurf von Ätzmasken..... | 140 |
| 4.7 | Dotierung..... | 142 |
| 4.7.1 | Diffusion | 142 |
| 4.7.2 | Ionenimplantation..... | 146 |
| 4.7.3 | Vergleich der Dotierungsverfahren | 148 |
| 4.8 | Verbindungsverfahren..... | 149 |
| 4.8.1 | Eutektisches Bonden | 150 |
| 4.8.2 | Anodisches Bonden..... | 151 |
| 4.8.3 | Siliziumdirektbonden..... | 152 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 4.8.4 | Vergleich der Verbindungsverfahren | 152 |
| 4.9 | Isolationstechniken | 153 |
| 4.9.1 | SIMOX-Verfahren | 154 |
| 4.9.2 | BESOI-Verfahren..... | 155 |
| 4.9.3 | Smart-Cut-Verfahren | 157 |
| 4.10 | Oberflächenmikromechanik..... | 158 |
| 4.10.1 | Prinzip | 158 |
| 4.10.2 | Herstellung von Hohlräumen | 161 |
| 4.10.3 | Haften beweglicher Strukturen | 164 |
| 4.10.4 | Vergleich von Volumen- und Oberflächenmikromechanik..... | 167 |
| 4.11 | Oberflächennahe Mikromechanik | 167 |
| 4.11.1 | Prinzip | 168 |
| 4.11.2 | Verfahren | 168 |
| 4.12 | HARMST | 171 |
| 4.12.1 | Begriffsbestimmung..... | 171 |
| 4.12.2 | LIGA-Verfahren..... | 171 |
| 4.13 | Miniaturisierte klassische Verfahren | 173 |
| 4.13.1 | Mikrospritzgießen | 175 |
| 4.13.2 | Mikroheißprägen | 178 |
| 4.13.3 | Mikrozerspanen | 179 |
| 4.14 | Auswahl von mikrotechnischen Fertigungsverfahren..... | 182 |
| 5 | Aufbau- und Verbindungstechnik | 190 |
| 5.1 | Aufgaben und Anforderungen | 190 |
| 5.1.1 | Aufgaben | 190 |
| 5.1.2 | Zuverlässigkeitsgerechtes Packaging | 194 |
| 5.2 | Funktionen der Aufbau- und Verbindungstechnik | 195 |
| 5.2.1 | Mechanische Verbindungen | 196 |
| 5.2.2 | Elektrische Verbindungen..... | 200 |
| 5.2.3 | Wärmeabführung | 201 |
| 5.2.4 | Verkapselung und Gehäusung | 202 |
| 6 | Funktions- und Formelemente der Mikrosystemtechnik | 209 |
| 6.1 | Mechanische Elemente..... | 209 |
| 6.1.1 | Empfindlichkeit in Nutzrichtung..... | 212 |
| 6.1.2 | Querempfindlichkeit | 215 |
| 6.1.3 | Eigenfrequenz | 216 |
| 6.1.4 | Dämpfung | 216 |
| 6.1.5 | Güte | 218 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 6.1.6 | Amplitudengang..... | 218 |
| 6.1.7 | Spannung an der Einspannstelle..... | 219 |
| 6.2 | Fluidische Elemente | 224 |
| 6.2.1 | Kennzahlen und Modellsysteme..... | 224 |
| 6.2.2 | Elementtypen | 228 |
| 6.2.3 | Fluidische Schnittstellen..... | 231 |
| 6.2.4 | Entwurf mikrofluidischer Elemente und Komponenten..... | 231 |
| 6.3 | Thermische Elemente | 236 |
| 6.3.1 | Thermisch-elektrische Analogien | 237 |
| 6.3.2 | Grundgleichungen für den Wärmetransport | 237 |
| 6.3.3 | Ersatzschaltungen..... | 242 |
| 7 | Sensoren und Aktoren | 250 |
| 7.1 | Umkehrbare und parametrische Wandler..... | 251 |
| 7.1.1 | Umkehrbare Wandler | 251 |
| 7.1.2 | Parametrische Wandler..... | 258 |
| 7.1.3 | Stationäre umkehrbare Wandler | 260 |
| 7.2 | Wandler für Sensoren und Aktoren..... | 263 |
| 7.2.1 | Elektrostatische Wandler | 263 |
| 7.2.2 | Piezoelektrische Wandler..... | 269 |
| 7.2.3 | Elektrodynamische Wandler | 272 |
| 7.2.4 | Thermomechanische Wandler | 278 |
| 7.2.5 | Piezoresistive Wandler | 286 |
| 8 | Entwurf von Mikrosystemen | 306 |
| 8.1 | Entwurfsmethoden und Werkzeuge | 306 |
| 8.2 | Systeme mit konzentrierten Parametern | 313 |
| 8.2.1 | Verhaltensbeschreibung elektromechanischer Systeme..... | 313 |
| 8.2.2 | Analyse des statischen Verhaltens elektromechanischer Systeme | 314 |
| 8.2.3 | Analyse elektromechanischer Systeme bei harmonischen Lasten..... | 317 |
| 8.2.4 | Transiente Analyse elektromechanischer Systeme | 321 |
| 8.3 | Systeme mit verteilten Parametern..... | 324 |
| 8.3.1 | Verhaltensbeschreibung mittels analytischer Modelle | 324 |
| 8.3.2 | Numerische Methoden auf der Basis der Finiten-Elemente-Methode | 327 |
| 8.3.3 | Makromodellierung komplexer Systeme durch Ordnungsreduktion | 329 |
| 9 | Einfluss technologischer Prozesse auf Mikrosystemeigenschaften | 338 |
| 9.1 | Parameterbasierter Mikrosystementwurf | 338 |
| 9.2 | Robuster Mikrosystementwurf..... | 342 |

| | |
|--|------------|
| Anhang A Physikalische Konstanten..... | 351 |
| Anhang B Koordinatentransformation | 352 |
| B.1 Elastische Koeffizienten | 353 |
| B.2 Piezoresistive Koeffizienten..... | 356 |
| Anhang C Eigenschaften von Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-Schichten | 359 |
| Anhang D Nomenklatur von Dünnschichtprozessen | 361 |
| Anhang E Haftung bei oberflächen-mikromechanischen Strukturen | 364 |
| E.1 Kapillarkräfte..... | 364 |
| E.2 Kritische Länge von Biegefedorne..... | 365 |
| Symbolverzeichnis..... | 367 |
| Abkürzungsverzeichnis..... | 375 |
| Stichwortverzeichnis | 380 |